

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 4 月 21 日 (21.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/036188 A1

(51) 国際特許分類: G01R 31/02

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/014095

(22) 国際出願日: 2004 年 9 月 27 日 (27.09.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2003-353879
2003 年 10 月 14 日 (14.10.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): JSR
株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒1040045 東京
都中央区築地五丁目 6 番 10 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 木村 潔
(KIMURA, Kiyoshi) [JP/JP]; 〒3501236 埼玉県日高市

猿田 289 番地 1 株式会社 JSR マイクロテック
内 Saitama (JP). 下田 杉郎 (SHIMODA, Sugiro) [JP/JP];
〒3501236 埼玉県日高市猿田 289 番地 1 株式会社
JSR マイクロテック内 Saitama (JP).

(74) 代理人: 大井 正彦 (OHI, Masahiko); 〒1010052 東京都
千代田区神田小川町三丁目 6 番地 1 栄信ビル Tokyo
(JP).

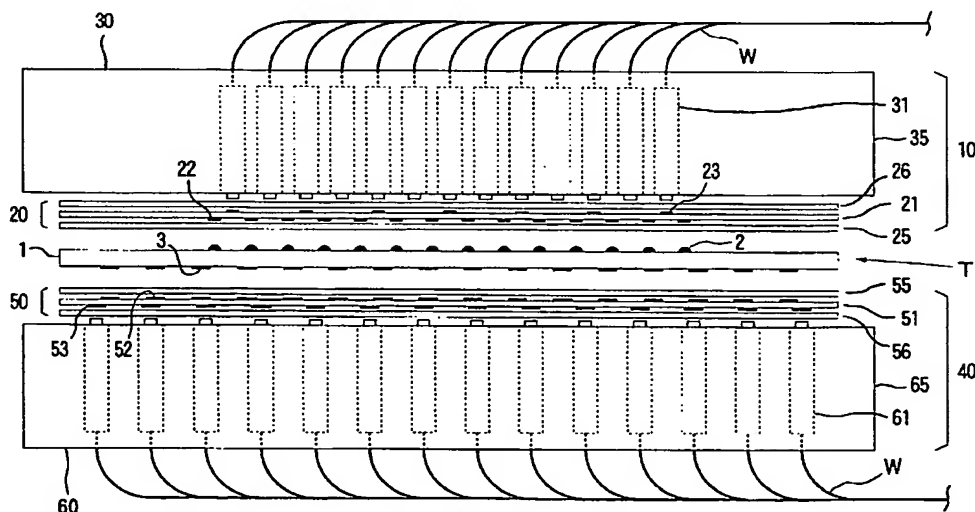
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

(54) Title: CIRCUIT BOARD INSPECTION DEVICE

(54) 発明の名称: 回路基板検査装置



(57) Abstract: A circuit board inspection device is used for inspecting a circuit board where a plurality of electrodes to be inspected are arranged in a gridiron shape. The circuit board inspection device includes: an adapter having a connection wiring plate on surface of which a plurality of connection electrodes are formed so as to correspond to the electrodes to be inspected and an anisotropic conductive elastomer sheet arranged on the surface of the connection wiring plate; and a pressing pin mechanism having a plenty of pressing pins arranged at the rear side of the connection wiring plate. The pressing pins are arranged in such a manner that at least one pressing pin is contained in a rectangular area defined by connecting the center points of four adjacent connection electrodes.

[続葉有]



SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

本発明の回路基板検査装置は、格子状に複数の被検査電極が配置された回路基板を検査する回路基板検査装置であって、表面に複数の接続電極が被検査電極に対応して形成された接続用配線板、および接続用配線板の表面上に配置された異方導電性エラストマーシートを有するアダプターと、接続用配線板の裏面側に配置された多数の押圧ピンを有する押圧ピン機構とを具え、押圧ピンは、押圧ピン機構およびアダプターを厚み方向に透視したとき、隣接する4つの接続電極の中心点を結ぶことによって区画される矩形の領域内に、少なくとも1個の押圧ピンが位置するよう配列されている。